

# Transistors à effet de champ: Labo $2\,$

# AL-ZUBAIDI Ahmed, DUSPEAUX Antoine, RONDIA Arthur $13 \ {\rm novembre} \ 2024$

## 1 Partie A: Etude DC

- 1.1 Simulations Multisim
- 1.1.1 Simulation DC-Sweep
- 1.1.2 Evaluation des courbes et zones
- 1.1.3 Mesures à partir de la courbe
- 1.2 Manipulations physiques
- 1.2.1 Tableau des caractéristiques DC
- 1.2.2 Circuit sur breadboard
- 1.2.3 Courbe  $V_{ds}/V_{Id}$
- 1.2.4 Evaluation pour  $V_{GS} = 4$ , 4.5 et 5 V
- 1.2.5 Courbes  $V_{ds}/V_{Id}$  pour différents  $V_{gs}$
- 1.2.6 Evaluation des  $R_{ds}$  et  $I_{ds}$  des courbes et zones
- 1.2.7 Courbe de transfert  $V_{\rm gs}/V_{\rm Id}$  avec  $V_{\rm ds}=10~{
  m V}$
- 1.2.8 Evaluation de  $V_{\rm th}$  et  $g_{\rm m}$

### 2 Partie B: Etude AC

- 2.1 Simulations Multisim
- 2.1.1 Simulation transitoire de  $V_{\mathbf{G}}$ ,  $V_{\mathbf{D}}$  et  $V_{\mathbf{1}}$
- 2.1.2 Description des imperfections dues aux capacités parasites
- 2.1.3 Constats pour  $R_2 = 100$
- 2.1.4 Constats pour  $R_2 = 100k$ ,  $R_1 = 10$
- 2.1.5 Estimation du courant maximum de charge de  $C_{gs}$  et  $C_{gd}$
- ${\bf 2.1.6}$  Simulation du courant  $I_{\bf g}$  et comparaison au développement théorique
- 2.2 Manipulations physiques
- 2.2.1 Circuit sur breadboard
- 2.2.2 Mesure à l'oscilloscope des tensions  $V_{\mathbf{G}}, V_{\mathbf{1}}$  et  $V_{\mathbf{D}}, V_{\mathbf{1}}$  et comparaison aux simulations
- 2.2.3 Mesure à l'oscilloscope de  $V_{\mathbf{G}}$  et  $V_{\mathbf{D}}$  pour démontrer les effets capacitifs parasites

### 3 Conclusion